2021A1654

BL46XU

BiFeO3-BaTiO3 磁性強誘電体結晶の逆格子マッピング および微小部回折測定 Reciprocal Space Mapping and Micro-Diffraction of BiFeO3-BaTiO3 Multiferroic Crystals

<u>薮田 久人</u>^a, 古田 達雄^a, 小金澤 智之^b <u>Hisato Yabuta</u>^a, Tatsuo Furuta^a, Tomoyuki Koganezawa^b

^a キヤノン(株) R&D 本部, ^b(公財)高輝度光科学研究センター ^a R&D Headquaters, Canon Inc., ^b JASRI

ペロブスカイト型 (1-x)BiFeO₃-xBaTiO₃ 固溶体セラミックスは x が約 0.3 以上では立方晶的な構 造を示しながら強誘電性と大きな圧電応答を示し、その本来の結晶構造および巨大強誘電性・圧 電性の起源に興味が持たれている。前回(2014B)、この材料系の本来の結晶構造に関する知見を 得る目的で、BiFeO₃-BaTiO₃ 単結晶の 3 次元逆格子マッピング測定を BL46XU にて実施したが、 条件出し等に時間を割いた関係で 110 など低波数(Q) での回折線の取得に留まった。今回は同じ 結晶を用いて、高 Q 回折や微弱な回折など、多くの回折データを前回以上の空間分解能で取得す ることに成功した。

キーワード: 逆格子空間マッピング、3次元データ、圧電体、非鉛、強誘電体、ドメイン

背景と研究目的:

現在、アクチュエータなどに使用されている圧電材料は PZT などの環境負荷の高い鉛を含有し たものが主流であるが、我々は環境を重視した持続的発展を目指す産業構造への転換の観点から、 鉛を排除した非鉛圧電材料の開発に取り組んでいる。その中で、大きな圧電歪を示す BiFeO3-BaTiO3系の圧電セラミックス材料の開発に成功した [1, 2]。この材料系の粉末 X 線回折による平 均構造は立方晶的であるにも関わらず、大きな強誘電性・圧電性を示しており、そのメカニズム は解明されていない。我々は圧電定数が最大になる組成近傍の BiFeO3-BaTiO3 固溶体単結晶成長 に成功し、実験室系の4軸回折装置より逆格子マップを取得し、立方晶的な結晶構造でありなが らドメイン構造を示唆する特徴的な回折パターンなどを確認したが、X 線強度不足等の理由によ り明瞭なデータとは言い難かった。そこで 2014B 期に SPring-8 BL46XU において BiFeO3-BaTiO3 単結晶の逆格子マップ測定を実施した。SPring-8 では 2 次元検出器を用いて逆格子空間の膨大な 情報を容易に取得でき、そこから構築した3次元逆格子空間マップの情報は絶大であり、実験室 系での測定データからはわからなかった情報を直感的に明らかにした。その結果を透過電子顕微 鏡像によるドメイン構造とともに考察することで、BiFeO3-BaTiO3結晶構造が立方晶からわずかに 歪んだ三斜晶ではないかという考察を、上記データとともに学術論文として公表するに至った[3]。 しかし、前回実験では低波数(Q)の少数の回折データのみの取得でありデータ不足であった。 今回の実験は、(1)前回実験で得られなかった高Q回折のデータ取得を実施するとともに、(2)前回 よりも高い空間分解能で、(3)強度の弱い回折データまで取り込むことを試みる。それらのデータ を解析・考察することにより、本来の結晶構造の情報を獲得したい。

実験:

(1-x)BiFeO3-xBaTiO3 固溶体単結晶は Bi₂O3 をフラックスとしたフラックス法により作製した。 組成比 x が 0.25 と 0.33 近傍の結晶が得られるように原料比を調整して得られた結晶の組成を電 子プローブマイクロ分析(EPMA)により調べたところ、それぞれ 0.28 および 0.37 であった。

逆格子空間マッピング測定は BL46XU において HUBER 多軸回折計を用いて行った。使用した X線のエネルギーは 8keV で、挿入光源・2結晶分光器は X線強度が最大になるようにセットし、 2結晶分光器下流側に設置されているミラーで高調波の除去と集光を行った。実験ハッチ最上流 に設置している 4象限スリットで試料に入射する X線を 0.2×0.2 mm 程度に成形して結晶に入射

させた。今回測定に用いた結晶の大きさは数 100 µm であり、細いアクリルロッドの先端にワック スで固定して、そのアクリルロッドを多軸回折計の試料ステージにセットした。回折 X 線の検出 には 2 次元検出器 (PILATUS 300K; 487 × 619 pixels)を用いた。前回 2014B の実験[4]で用いた 2 次元検出器は PILATUS 100K であり、今回用いた PILATUS 300K は 100K のユニットを 3 個並べ たものであり、より広い視野のデータを一度に取得できる。そのため、カメラ長は前回(446 mm) より長い 530 mm に設定し、より高い空間分解能でのデータ取得を志向した。検出器 PILATUS 300K の x 軸を 20 方向、y 軸を 20z 方向になるように設置した結果、20 方向に約 9.0°、20z 方向に 約 11.3°の視野を確保した。20z 方向の回折線の広がりは試料ステージの x 軸スキャンデータに相 当する。データ取得は検出器に入射される回折 X 線が 1 Mcps を超えないように入射 X 線に挿入 するアッテネータを回折線毎に選択しながら、1 枚につき 1 秒 (極端に弱い回折線については 1 枚 につき 5 秒)の露光時間で試料ステージの ω 軸をスキャンしながら 1 つの回折線につき 300 から 500 枚の回折パターンを取得した。測定はすべて室温、大気中で行った。

結果および考察:

高Q回折データの取得について

今回の実験では、前回取得できなかった高Q(大きい20角)での回折線の取得を第一の目的としたが、PILATUS 300Kのような体積が大きく重量のある検出器を大きな20角位置に設置した実験の経験が乏しく、万が一の落下事故で高価な検出器が破損するのを防ぐために、20最大角を90°、 0最大角を60°に設定した。また、軸の移動などの操作の際にはケーブルや付属品等の動きにも細心の注意を払い、干渉等がないことを確認しながら動作させた。図1に20軸を89°に設定したときの多軸回折計の外観図を示す。重量物であるPILATUS 300K が試料のほぼ鉛直上方にあり、落下を想像すると不安に駆られるが、しっかり固定してあり問題ないことを確認した。



図1 PILATUS 300K を第二2 θ 軸 (tth2)に搭載したHUBAR製 多軸回折計の外観図。 (2 θ = 89°にセット) 左:ビーム下流側からの外観 右:回折計側面からの外観

図 2 に 0.72BiFeO₃-0.28BaTiO₃ 結晶の 203 回折図形(今回実験の 20 最大角である 20 ≈ 89°で取 得)を示す。これは θ 軸を[100]方向に±2.5°スキャンさせながら取得した 500 枚の回折図形デー タの重ね合わせ図である。図の縦方向が 20、横方向が 20z(//χ[010])に対応している。このよう に明瞭な高 Q 回折線の 20 – θ – χ 3次元データを取得することができた。図中の 2本の黒い縦の 帯は検出器ユニットの継ぎ目に対応し、その部分のデータは取得できていないが、全体像を認識 するには十分と考えている。必要があれば、継ぎ目の部分を埋めた回折図形を今後取得したい。

PILATUS 300K のユニット継ぎ目によるデータ欠損点を補う簡便な方法としては、検出器位置 を僅かにずらして同じ回折図形データを取得し、主とする回折図形データの欠損点に対応するデ ータを検出器位置をずらして取得したデータから補うという手法が考えられる。その場合、図 2 から見て取れるように 20z 方向に僅かに平行移動させたデータを取得すると、容易にデータ欠損 点の補充が可能である。ただし、20 が大きい場合には実際の 20z をずらしても PILATUS 300K 取 得画像としては横方向にずれた画像とならないことに注意しなければならない。今回のカメラ長 設定では 20 が 70°程度以下であれば、20z を 1°ほどずらして測定することで欠損点データを取得 できる。図 3 は 0.72BiFeO₃-0.28BaTiO₃結晶の122回折図形(20=71°)で、右図が主データ(20z = 0°)であり、中央図が主データの欠損部分を補う為に 20z = -1°で取得したものである。20=71°の 条件で 2θz を 1° だけずらすと、ちょうど欠損部の黒い帯の幅と同じ程度だけ回折図形が横にずれ ているのが見て取れる。これを簡単な三角比の計算で欠損部データを補うことで、右図のように 欠損部のない回折図形が得られた。上述のとおり、より大きな 2θ(より高 Q)の回折図形に関し ては、今回の実験ではデータ欠損部の補完は行わずに解析・考察を実施するが、必要があればデ ータ欠損部を補完した回折図形を改めて取得するつもりである。その場合は 2θz をずらした測定 では対応できないので、χ軸を僅かにずらしてのデータ取得などを検討したい。



図 2 PILATUS 300K検出器で取得した 0.72BiFeO₃-0.28BaTiO₃結晶の203回折図 形(2 $\theta \approx 89^{\circ}$)。 θ 軸を[100]方向に ±2.5°スキャンしながら取得した500枚の 回折図形データの重ね合わせ。縦軸が2 θ 方向、横軸が2 θ z(// χ [010])に対応。



- 図3 PILATUS 300K検出器で取得した0.72BiFeO₃-0.28BaTiO₃結晶の122回折図形(2 $\theta \approx 71^{\circ}$)。 左: 2 $\theta z = 0^{\circ}$ で取得した回折図形。 中央: 2 $\theta z = -1^{\circ}$ で取得した回折図形。
- 右: 2 θ z = -1°データから左図のデータ欠損点のデータを補充し合成した回折図形。
- (2) 高分解能データ取得およびデータ再現性について

今回の実験では前回 2014B での実験より少しカメラ長を長くとり(466 mm → 530 mm)、より 大面積な2次元検出器を用いることで、前回よりも高分解能の回折データを取得することを第二 の目的としている。図4に今回取得した 0.72BiFeO₃-0.28BaTiO₃結晶の011回折図形(20≈32°)と 前回取得の回折図形との比較を示す。強度を対数表示にしているため、周辺部のバックグラウン ドレベルにおいても画素ごとのコントラストがついており、今回取得のデータにおいては若干で はあるが前回データよりも画素が細かく、すなわち高い空間分解能でデータ取得できていること が見て取れる。また、バックラウンドからピークトップにかけての強度階調の変化をみると、今 回測定のほうが広いダイナミックレンジでデータ取得できていることがわかる。回折線の形状は 前回と今回とでほぼ同じように見えることから、測定自体はよく再現されているものと判断した。

図4 0.72BiFeO₃-0.28BaTiO₃結晶の011回折図形(20≈32°)。強度は対数表示。

左: 今回の実験でPILATUS 300kによりカメラ長530 mmで取得したもの 右: 前回(2014B)の実験でPILATUS 100kによりカメラ長 466 mmで取得したもの





(3) 微弱な回折データの取得について

(1-x)BiFeO₃-xBaTiO₃ 固溶体のエンドメンバー (x=0) である BiFeO₃ は空間群 R3c の菱面体晶で あり、立方晶表記で[111]。方向に2倍の長周期構造を有し、粉末 X線回折において111。回折線の 少し 20 の低角側(低 Q 側)に 3/2 1/2 1/2。超格子回折線が観測される。(1-x)BiFeO3-xBaTiO3 固溶 体では x が小さい領域ではこの回折線は観測されるが、x = 0.3 近傍の擬立方晶的な構造に近い組 成では消失する(電子線回折ではx=0.3 近傍においても超格子反射が観測されることがある[3])。 実際に0.72BiFeO₃-0.28BaTiO₃単結晶をすりつぶして放射光粉末X線回折測定(BL19B2にて測定) を行った際にもこの超格子回折は見られなかった。今回の実験では BL46XU のアンジュレーター 光を用いてこの超格子回折線の観測を試みたところ、図5に示すように、露光時間を5秒とする ことで明瞭な回折図形を得ることができた。



図5 PILATUS 300K検出器で5秒露光により 取得した0.72BiFeO3-0.28BaTiO3結晶の 1/2-3/23/2回折図形(2θ≈50°)。 縦軸が20方向、



横軸が2θz (//χ[011]) に対応。

以上、結果(1)(2)(3)で述べたように、2014B期の実験に引き続き(1-x)BiFeO3-xBaTiO3 固溶体結晶 の3次元逆格子マップ測定を実施し、より高Q回折の逆格子マップを取得し、前回よりも高空間 分解能で、微弱な回折線までも観測することに成功した。

今後の課題:

引き続き、今回取得した 0.72BiFeO3-0.28BaTiO3 および 0.63BiFeO3-0.37BaTiO3 単結晶の 20-0χ 3次元データを用いて3次元逆格子空間マップを構築する。そして得られたパターンからそれ ぞれの結晶本来の結晶構造およびドメイン構造についての知見を得るべく、解析および考察を実 施する。高O回折(20>71°)のデータについては PILATUS 300K のユニット継ぎ目のデータ欠陥 がある状態での解析となるが、問題が生じた場合は欠陥部のデータを埋めるための追加実験を行 うべく再度の課題申請を検討したい。

参考文献:

[1] H. Yabuta et al., Jpn. J. Appl. Phys. 51, 09LD04 (2012).

- [2] I. Fujii et al., J. Ceram. Soc. Jpn. 121, 589 (2013).
- [3] H. Yabuta et al., Appl. Phys. Lett. 116, 252902 (2020).
- [4] 薮田久人、渡邉隆之、久保田純、平成 26 年度 SPring-8 産業新分野支援課題・一般課題(産業 分野) 実施報告書 (2014B) pp. 42, 2014B1603.